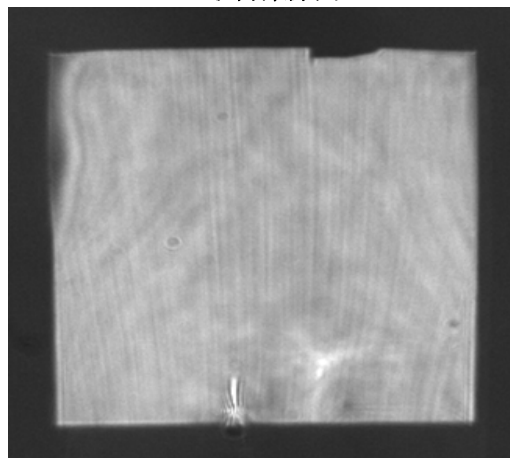


チップクラック観察装置 SM30mini

装置外観例



取得撮像例



概要

トレイ上又はテープ上に配置されたチップ外周のクラックや欠けをマクロ視野で観察可能。
スーパーマクロ光学系と、ハイビジョンカメラの、組み合わせによって微小なクラックや浅い剥離など
顕微鏡観察では見えにくい、不良をコントラスト良く観察する事が出来ます。スーパーマクロ光学系では
クラックの線幅が実際よりも大きく見えるので、視野が広く短時間でチップ全体を観察する事が可能です。
低価格、7.5万円～、オプションで、PCによる自動検査も用意しております。

装置構成例

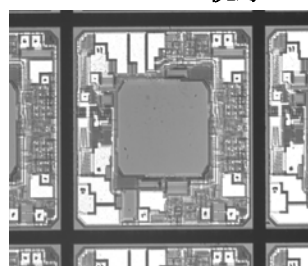
- (1) スーパーマクロ光学系 (SM-30) : 標準視野サイズ約 6.5 mm × 5.0 mm
- (2) 1/3インチ ハイビジョンカメラ : 1280 × 720 モノクロ又は、カラー
HDMI出力 60Hz
- (3) CCTVレンズ : f = 7.5 mm 又は 5.0 mm から選択
- (4) LED照明及び電源
- (5) モニター : カメラスタンド : 選択可

アプリケーション

- ウエハーチップの外周クラック検査
- ウエハーチップの面内検査と評価
- ウエハーチップのBG研磨痕の評価
- ウエハーチップの表面ピット、ピンホール検査
- ウエハーチップの外形、外観検査
- ウエハーチップのダイシングによる残留応力の可視
- ウエハーチップでその他、外観検査全般
- オプションで、自動外観検査 (インライン対応)

観察画面

SM-30の視野



顕微鏡10倍の視野



SM-30のデジタル拡大

